化合物系太陽電池のポテンシャルと課題

佐藤 勝昭

(独)科学技術振興機構さきがけ「次世代デバイス」研究総括 102-0076 千代田区五番町7 K's 五番町 5F e-mail: <u>katsuaki.sato@nifty.com</u>

現在実用されている太陽電池のうち最も高い変換効率を示すのは III-V 族単結晶系多接合太陽電池で、 集光型で 42%という値が報告されている。III-V 族単結晶系は高効率であるが、高コストであるため宇 宙用やソーラーカーレース用としてのみ使われている。低コスト化のために III-V 族多結晶系の研究が 進んでいるが高効率化、大面積化には課題も多い。一方、化合物多結晶薄膜系は、安価な基板とシンプ ルなプロセスによって低コスト化が諮られ、すでに CdTe、CIGS 系が量産体制にはいり、普及が進ん でいる。これらは、理論限界変換効率には達しておらず、高効率化のポテンシャルがあると考えられる が課題も多い。ここでは、化合物系太陽電池を結晶工学の観点から俯瞰し、今後の研究開発の方向性を 示したい。

1. 理論限界変換効率と化合物半導体

図1は、理論的に予測できる単接合太陽 電池の最大の変換効率(25°)をバンドギ ャップ E_{g} の関数として表した曲線で、「理 論限界変換効率曲線」と呼ばれる¹。理論 限界変換効率は E_{g} =1.4eV 付近で最大値 30%をとる。なぜピークを持つかというと、 1.4eV 以下では、 E_{g} が小さくなると開放端 電圧 V_{OC} が低下するのに対し、1.4eV 以上 では、 E_{g} が上がるとスペクトルの利用効 率が低下し短絡電流 I_{sc} が低下するからで ある。図には実際の半導体で実現している 最大変換効率を黒丸で示してある。



図 1. 太陽電池の理論限界変換効率のバンドギャップ依存性

表1.バ	ンドギャ	ップが 1.0~1.7eV	の間にある半導体
------	------	---------------	----------

半導体名	Eg (eV)	直接/間接	結晶構造	半導体名	Eg (eV)	直接/間接	結晶構造
CuInSe ₂	1.04	直接	СН	GaAs	1.42	直接	ZB
Si	1.12	間接	D	CdTe	1.47	直接	ZB
$ZnGeAs_2$	1.15	直接	СН	$CuInS_2$	1.53	直接	СН
AgGaTe ₂	1.15	直接	СН	$CdSiAs_2$	1.55	直接	СН
$CdSnP_2$	1.17	直接	СН	AlSb	1.62	間接	ZB
CuGaTe ₂	1.23	直接	СН	CuGaSe ₂	1.68	直接	СН
$AgInSe_2$	1.24	直接	СН	$CdGeP_2$	1.72	直接	СН
InP	1.34	直接	ZB	a-Si:H	1.7	_	非晶質

D:ダイヤモンド構造、ZB:閃亜鉛鉱構造、CH:カルコパイライト構造

表1は、バンドギャップが1.0~1.7eV の範囲にある 半導体をまとめて掲げたもので、理論限界変換効率が 25%以上となるバンドギャップをもつ化合物半導体が多 いことがわかる。このうちピークに最も近いのは、III-V 族半導体 GaAs と II-VI 族半導体 CdTe である。

これに加えて、太陽電池の変換効率に大きく寄与する のが、半導体の光吸収の強さである。図2は、いくつか の半導体の光吸収係数の自然対数を光子エネルギーに対 してプロットしたものである。結晶 Si に比べ、化合物半 導体の多くが2桁程度大きな吸収係数をもち厚さ1~2 µmの薄膜でも十分な電力を取り出せるので、資源の節 約になるというメリットがある。CuInSe2は現存する半 導体の中で最も高い吸収係数をもつとされるが、後に述 べるように価電子帯の頂に状態密度の大きな3d電子状 態が混成していることに起因すると考えられている。 CuInSe2のバンドギャップは、理論限界効率のピークか ら見るとやや低いので、通常はCuGaSe2とのアロイ CuIn1-xGaxSe2(CIGSと略称)を用いている。



図2. 主な半導体の光吸収スペクトルの比較 結晶シリコン(x-Si)は間接遷移型吸収端をもつた め光吸収係数が小さいが、直接吸収端をもつ CuInSe₂,, GaAs, CdTe などの化合物半導体は Si より2桁近く大きな吸収係数を示す。

2. 化合物系太陽電池のパフォーマンス

表2は、3種類(III-V族、CIGS 系、CdTe系)の化合物系太陽電池の モジュールとセルにおける変換効率 のチャンピオンデータを示している。 CdTe も CIGS もモジュール効率は 10%を超えているが、セルの効率は これよりはるかに高いので、化合物 がもつ高いポテンシャルを生かし切 れていない。このギャップを埋める には、結晶工学的アプローチが必要 である。

III-V 族系の 41.6%というのは、 GaInP/GaAs/Ge という 3 接合タン デム構造で得られたもので、III-V 族単体でこの表に示すような高い変

表 2. 化合物太陽電池の比較

小分類	現状の変換効率(%)**		モジュール	資源	時間	
	モジュール	セル	コスト***		2.2.9	
□-Ⅴ族	36.1	41.6			超高効率。宇宙用。 高コスト、資源問 麹に離	
CIGS系	13.6	20.0	(0.99)¢	0	低コストで大面積 可能。省資源。大 面積効率に難	
CdTe采	10.9	16.7	0.98+		低コスト、大量生 産。中効率。Cd 使用が問題	

& 2008年: Nanosolar 社の発表 (role-to-role)

⁺ 2009 年: First Solar 社発表# Estimation: Joseph Kalowekamo, Erin Baker: Estimating the manufacturing cost of purely organic solar cells; Solar Energy 83, 1224-1231 (2009)

** M.A.Green et al. :Solar cell efficiency tables (version 35); Progress in Photovoltaic Research Application, vol.18 (2010) pp.144-150.

*** ピークパワー1W あたりのモジュールコストを米ドルで表したもの

換効率を示すわけではない。表3は、いくつかのIII-V族系太陽電池の変換効率を比べたものである。 GaAsの単接合薄膜では非集光で26.1%、集光型で28.8%と図1の理論限界効率をほぼ達成している。 高効率III-V族系のほとんどは単結晶基板上にエピタキシャル成長した薄膜を使っている。多結晶Ge 基板上に作製された多結晶GaAs太陽電池の場合0.25cm²のセルにおいて21%が得られているに過ぎな い。安価な青板ガラスを用いて20%の変換効率を出しているCIGSと比べてコスト的に不利である。

表 3. III-V 族化合物系太陽電池の変換効率のチャンピオンデータ

材料	非集光/集光	接合数	췖子数	安換効率 (%)	発表者、発表年
GaAs (薄膜)	非集光	単接合	2	26,1	Radboud U.2009
GaAs	集光 (232sun)	単接合	2	28.8	Fraunhofer,2009
GaAs (多結晶) /Ge基板	非集光	単接合	2	18.4	RTI,1997
InP (エビ薄膜)	非集光	単接合	2	22.1	Spire, 1990
GalnP/GaAs	非集光	2接合	2	30.3	Japan Energy,1996
GalnP/GaAs/Ge	非集光	3接合	2	32.0	Spectrolab.,2003
GaAs/CIS	非集光	2接合	2	25.8	Kopin/Boeing,1988
GalnP/GaAs/Ge	集光 (364sun)	3接合	2	41.6	Spectrolab.,2009

出典:M.A.Green et al.: Solar cell efficiency table(version 35), Prog. Photovolt: Res. Appl. 18 (2010) 144-50

3. 化合物系多結晶太陽電池の構造と薄膜形成プロセス

図3はCdTe系太陽電池の構造の模式図である。透 明導電膜をつけたガラス基板に、n層としてCdS薄膜、 p層として近接法でCdTe薄膜を積層し、裏面電極と してカーボンを塗布した簡単な構造をもつ。近接法と は、多結晶粉末をプレスして固めたセラミクス原料を 加熱して昇華させ、接近して対向している基板に堆積 させるもので、ベルトコンベアで移動させることで大 面積の成膜が可能である。このため大量生産に向くと 考えられている。CdTeの成膜法には、近接法以外に



図 3. CdTe 太陽電池セルの構造

スクリーン印刷法、スプレー法、電着法などが報告されている。また、CdCl2をフラックスとして用いることによって CdTe の粒径を大きくすることができると報告されている。

図4は典型的なCIGS系太陽電池セルの構造である。基板としては安価な青板ガラスを用い、基板上 にモリブデン薄膜をスパッタ法で堆積、続いてCIGS

(あるいは CIGSSe) 薄膜を3段階多元蒸着法、または合金薄膜のセレン化法で堆積し、次いでワイド ギャップ材料の超薄膜をバッファー層として CBD

(化学薬品浸漬)法によって堆積する。さらに酸化 亜鉛透明導電膜を MOCVD(有機金属気相化学堆積 法)などによって堆積し、最後に金属配線をつける。



図 4. CIGS 太陽電池セルの構造

3段階多元蒸着法では、 Cu、In、Ga、Seの4元素を3つの段階にわけて堆積し、CIGS 膜を形成 する。第1段階ではIn、Ga、Seを堆積、第2段階でCu、Seを堆積、第3段階では、微量In、Ga、 Seを堆積して組成を調整する。20%の高効率セルはこの方法で作製されたものである。

合金薄膜セレン化法 では、Cu、In、Ga を原料としてスパッタ法で合金膜を堆積し、Se, TBSe, H₂Se などを用いてセレン化して、CIGS 薄膜を作製する。中効率であるが、大量生産に向く。

図5は多結晶 Ge 基板上の多結晶 p+/n 接合 GaAs 太陽電池(小面積変換効率21.2%)の構造である²。 キャスト法で作製した光学グレードの大粒径 Ge 多 結晶基板上に MOCVD 法で GaAs を堆積する。基板 直上には高濃度の As を含む n+核発生層、次いで薄 い n+裏面障壁層、厚い n ベース層、薄い無添加スペ ーサ層(暗電流低減のため挿入)、薄い p+エミッタ層、 p+AlGaAs 窓層、n+オーミック接触層、Ti/Au 上面電 極という複雑な構造をとる。開放端電圧はスペーサ 層厚が薄い程大きな値をとる。また、ベース層の n 形ドーパントとして VI 族の S, Se を用いることで、 パシベーション効果によって短絡電流密度が増加す るとされている。MOCVD 法は大面積にわたって均 ーに制御性よく成膜できることから量産向きである。

4. 化合物半導体のバンド構造の特徴

III-V 族の GaAs と II-VI 族の CdTe は、どちらも閃 亜鉛鉱構造をとる。両者のバンド構造は図 6 に模式的 に示すように非常に似ておりいずれも直接遷移型バ ンドギャップを示す。価電子帯は主としてカチオンの p 軌道から成り立っているので、スピン軌道分裂 Δ so は As より Te の原子番号が大きいことによって GaAs (Δ so=0.35eV)より CdTe(Δ so≈0.9eV)のほうがはるか に大きい。

これに対して、CuInSe2のバンド構造は図7に示す ように価電子帯は非常に複雑な様相を見せる³。これは、Cu-III-VI2系のカルコパイライト型半導体に特

有のことで、価電子帯はSeの4p軌道とCuの3d軌道が混成した状態からできている。分子軌道法の ことばでいうと価電子帯の頂はCu3dとSe4pの反結合状態に対応し、伝導帯の底は、In5sとSe4pの

反結合状態に対応する。このため、バンドギャップ は、反結合軌道同士の間に開いており、このことに よって、Cu空孔およびSe空孔が深い準位をつくる ことがないとされている。このような状況は I-III-VI2族の二元類似物であるII-VI族には見られ ない特徴である。また、I-III-VI2族カルコパイライ ト型半導体の結晶構造は、閃亜鉛鉱構造を2段重ね にして、2種類のカチオンをオーダーさせたが正方 晶カルコパイライト構造をとる。c軸の長さはa軸 の約2倍であるが、一般には2からずれていて、物 性値は一軸異方性を示す。

和田によれば、CIS の化学結合の特徴は、Cu-Se



図 5. 多結晶 Ge 基板上の p⁺//n 接合 GaAs 太陽電池の 素子構造



図 6. GaAs と CdTe のバンド構造の模式図



図 7. CuInSe2のバンド構造(LDA 計算では、点線 のようにバンドギャップが開かないが、sX-LDA 法 では、実線のようにΓ点に直接ギャップが開く。)

と In-Se の2種類の化学結合が存在し、Cu-Se の結合は非常に弱く In-Se の結合は比較的強いことで あるという。Cu-Se 結合では、3d 軌道が価電子帯に混じっていることが結合の弱さの原因であるとし ている。そのため、CIS の結晶を成り立たせているのは In と Se の結合で、Cu はバンド構造や電子 物性には重要な働きをしているが、結晶構造を成り立たせているという観点からは寄与は小さい4。

5. 化合物半導体の真性欠陥

化合物半導体は、Si のような元素半導体と比べて遙かに多数の真性欠陥を有する。Si の真性欠陥は Si の空孔 Vsi および格子間原子[Si]_i およびこれらの複合欠陥しかない。これに対して、GaAs の真性欠 陥は、空孔 VGa, VAs, 格子間原子[Ga]_i, [As]_iに加え、アンチサイト欠陥[As]_{Ga}, [Ga]_{As} が存在する。さら に、これらの複合欠陥も存在する。図 8 は、これまでに DLTS, ICTS, ODMR, PL, 光伝導等で調べら

れた GaAs 中の真

性欠陥および不純 物の作る深い準位 をまとめたもので ある⁵。Cu, Cr, Ni, Fe などと書かれた 準位以外は、真性欠 陥が関与した複合 欠陥と考えられて いる。例えば、



れる EL2 と名付け られた欠陥は、アン

チサイト欠陥

LEC-GaAs で見ら

図 8. GaAs において観測されている電子トラップ準位およびホールトラップ準位 ⁵⁾

[As]Ga が関与する複合欠陥で、その相手は、格子間原子 [As]iとも空孔 VAsともいわれているが決着はついていない。いずれにせよ、GaAsにおいては、非常に多くの深い準位がギャップ内に生じるため、 光キャリアのトラップ準位や再結合中心として働き、変換効率を低下させる原因となる。

同様の研究が CdTe についても行われている。CdTe には、Vcd, VTe, [Cd]i, [Te]i, [Cd]Te, [Te]cd などの 真性欠陥およびそれらの複合欠陥準位がある。CdTe は通常 p 型になるが、これは、Vcd によると考え られる。CdTe の Cd サイトに In を置換しようとしても、Vcd との複合欠陥をつくり、ドープしたキャ

リアを補償して n 型にならない。したがって、CdTe 系 太陽電池にでは、アニオン空孔によって無添加で n 型に なりやすい CdS とのヘテロ接合が用いられている。

三元化合物CuInSe₂となると、欠陥の種類はさらに増 える。カチオン空孔V_{Cu}, V_{in}, アニオン空孔V_{Se}、格子間 原子I_{Cu}, I_{In}, I_{Se}、さらに、置換欠陥[Cu]_{In}, [In]_{Cu}、およ び複合欠陥が見られる。表4は、Neumann⁶, Möller⁷, Zhang⁸, Wada⁹によるCuInSe₂中の主な欠陥の生成エネ ルギーである。計算方法によってかなりのばらつきがあ るが、V_{Cu}が形成されやすいことがわかる。CuInSe₂が 通常p型伝導を示すのはV_{Cu}アクセプタによる。太陽電池 表4. CuInSe2 における欠陥生成エネルギー Neumann Möller Zhang

	Neumann	woner	Znang	wada
/Cu	2.6	3.2	-0.89	-0.81
/ In	2.8	2.4	1.73	0.37
/Se	2.4	2.6	3	1.7
[Cu]i	4.4	-	3.56	_
[In]i	9.1	-	-	-
[Se]i	22.4	-	-	-
Cu]In	1.3	1.9	1.37	-
In]Cu	1.4	1.6	2.89	-

としては、p-CuInSe₂とn-CdS、n-ZnS等のヘテロ接合が用い られるが、実際は、n-CdSをCBD(化学浸漬法で成膜する際 にII族元素が拡散し、CuInSe₂内にburied junction を形成し ているのではないかと考えられている。

6. 多結晶化合物太陽電池の課題

(a) 結晶粒のサイズと転位密度の効果

多結晶 GaAs 系において結晶粒界はキャリアの再結合中心 として働くため大きな粒径が必要である。図9は、(a)のよう な粒径モデルにおいて計算で得られた GaAs 多結晶太陽電池 における少数キャリア拡散長を粒径に対してプロットしたも のである¹⁰。これにより、単結晶並みの少数キャリア拡散長 を得るには、mm サイズの結晶粒を有する多結晶膜が必要で あるが、デバイス構造の工夫によって 100 μ m 程度でも高効 率化画可能であるとされている。

一方、CIGSで実用化されているのは粒径1µm~2µm の多 結晶薄膜が使われている。なぜ、GaAs多結晶ではmmサイズ が必要なのに、CIGS系ではµm サイズでよいのであろうか。 Pearson, Zungerらは、CIGS薄膜においては、粒界付近で価 電子帯頂の低下が起きて、結晶粒内部のホールの障壁となっ て粒界での再結合を防いでいると考えており¹¹、その後の高 解像度TEM観察で検証された¹²。



ける少数キャリア拡散長に及ぼす粒径 の効果(b)

GaAsにおいては粒径が大きいので転位によるキャリア再結合も問題になる。図 10 は Si 基板上の GaAs, InP および InGaP の少数キャリア拡散長の転位密度依存性の実測値と計算された曲線である。 これは、単結晶についての結果であるが、多結晶についても問題になるはずである。多結晶において、 転位密度を制御することは、単結晶よりはるかにむずかしい。CIGS においても転位があると考えられ るが、粒界の場合と同様に、転位が再結合に寄与しないと考えられる。

(b) CIGS 太陽電池の課題

CIGS 太陽電池の最高の変換効率は $1.1 \sim 1.2 \text{ eV}$ の E_g をもつ Ga/(In+Ga)比の膜で得られている。単接合太陽 電池での理想的な E_g である 1.4 eV を持つ CIGS 膜を用 いれば、20 %を大きく越える変換効率が期待される。し かし、現実には、Ga の組成比が増加すると結晶性が低下 するという問題もある。また、高効率が得られているのは, 薄膜においてバンドギャップの勾配をつけたものに限ら れているというのも問題である。和田は、今後シングルセ ルで変換効率 25 %,タンデムセルで 40 %という高い目 標を達成するためには、CIGS という多元系半導体を十分 に理解して、基礎および応用の両面にわたって幅広く研究 開発を推進していくことが必要であると述べている 4。



7. 終わりに

理論的に高い効率が期待される化合物太陽電池について、低コストで高効率な多結晶薄膜太陽電池の 実現を目指すためには、真性欠陥、粒界、転位などのもたらす問題点をきちんと理解するとともに、こ れまでに培われた材料選択、成膜技術、評価技術などを総動員して、総合的に問題の解決を図ることが 求められている。これらは、まさに、結晶工学の出番である。ぜひ多くの研究者の参画を促したい。

この小稿をまとめるに当たって、今回の研究会の企画社である産総研の反保様に貴重な資料¹³を提供 いただきました。また、龍谷大学の和田先生には、CIGS に関連した最近の研究資料をお送りいただき ました。ここに深く感謝します。

参考文献

- ³ T. Maeda and T. Wada: phys. status solidi (c) **6**, 1312-1316 (2009)
- ⁴ 和田隆博・前田 毅: 日本結晶成長学会誌 36, 42-49 (2009)
- ⁵ G.F. Neumark and K. Kosai: "Deep levels in wide band-gap GaAs semiconductors", Semicond. & Semimetals Vol.9, Chap.1 pp.1-74 (1983)
- ⁶ H. Neumann: Bindings in Semiconductors; in Geest Portig, p.406 (eds K. Unger, H. Schneider, Leipzig, 1986)
- ⁷ H.J. Möller, Semiconductors for Solar Cells, p.300 (Artech House, Boston, 1993)
- ⁸ S.B. Zhang, S.H. Wei, A. Zunger, H. Katayama-Yoshida: Phys. Rev. **B57**, 9642 (1998)
- ⁹ T. Maeda and T. Wada: J. Phys. Chem. Solids **66** 1924-1927 (2005)
- ¹⁰ M. Yamaguchi and Y. Itoh: J. Appl. Phys. **60** 413-417 (1986)
- ¹¹ C. Persson and A. Zunger, Phys. Rev. Lett. 91, 266401 (2003).
- ¹² D. Abou-Ras, B. Schaffer, M. Schaffer, S.S. Schmidt, R. Caballero, T. Unold: Phys. Rev. Lett. **108**, 075502 (2012)
- ¹³ 平成9年度太陽光発電技術研究組合研究成果報告書「III-V 族多結晶太陽電池の可能性調査」(1998.3)

¹ J.J. Loferski: J. Appl. Phys. 27, 777-781 (1956).

² R. Venkatasubramanian, B.C. O'Quinn, E. Siivola, B. Keyes, R. Ahrenkiel: Conf. Rec. 26th IEEE Photovoltaic Specialists Conf. pp.811-814 (1997)